РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **2012 151 740** (13) **A**

(51) МПК
G01N 29/04 (2006.01)

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2012151740/28, 03.12.2012**

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **03.12.2012**

(43) Дата публикации заявки: **10.06.2014** Бюл. № **16**

Адрес для переписки:
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское ш., 1, ОАО "ГРЦ Макеева"

(71) Заявитель(и):
Открытое акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" (RU)

(72) Автор(ы):
Иванов Эдуард Петрович (RU),
Источинский Данила Андреевич (RU),
Охотин Игорь Петрович (RU)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

(57) Формула изобретения

Способ изготовления эталонных образцов в форме параллелепипеда с искусственными дефектами для градуировки и установки порога чувствительности ультразвуковых дефектоскопов, включающий выполнение в образце технологических сквозных отверстий диаметром от 0,5 мм до 1,0 мм, перпендикулярных продольной оси образца и параллельных его рабочей поверхности, последующее введение в них обрабатывающего инструмента, применение электроэрозионной обработки для выполнения этим обрабатывающим инструментом узких сквозных пазов, параллельно сквозным технологическим отверстиям, высотой от 5 до 20 диаметров инструмента.

RU 2012151740 A

RU 2012151740 A